

JIEP 官能検査システム化研究会 第12回公開研究会開催のご案内
AIST 製造技術イノベーション協議会 インспекション技術研究会協賛
〈IoT 時代における検査〉

官能検査システム化研究会
主査 野中一洋（産総研）

◆ 開催趣旨

IoT の到来とともに産業・社会は大きな変革の時を迎えています。さまざまな階層でのつながりによって、製造分野においても新たなビジネスの可能性が大きく広がりを見せています。その一方で、これまで世界最高水準とされてきた日本の高品質・高信頼なものづくり力が大きく揺らいでおり、根本から見直しを迫られています。現場力を回復させるためのツールや手法、制度などの開発・整備は、喫緊の課題となっています。

本公開研究会では、IoT 時代に対応する検査技術として、AI の検査応用を中心に、画像、音響、及び X 線などを用いた最新の検査技術をご紹介します。

講演会終了後には交流会（無料）も予定しています。

皆さまの積極的なご参加をお待ちしております。

◆ 開催日時： 令和元年 7 月 23 日（火）〈13：30～16：50〉

◆ 会場： 回路会館 地下会議室

J R 中央線西荻窪駅下車徒歩約 7 分

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 TEL. 03-5310-2010

地図 → <https://web.jiep.or.jp/about/access.html>

テーマ： IoT 時代における検査

◆ プログラム

○ 13：00 受付開始

○ 13：30 開会挨拶

○ 13：35～14：15 一般講演 1 「画像検査への AI 応用に関する特色や開発の方向性」
名城大学 成田 浩久

○ 14：15～14：55 一般講演 2 「画像認識 AI 「Deeptector (R)」 製造業の検品作業への適用」
NTT コムウェア 宮下 直也

- 14：55～15：35 一般講演3「薄型 AE センサと機械学習を用いたワイヤボンディングの接合良否判定」

産総研 小石 泰毅

(15：35～15：50 休憩)

- 15：50～16：30 一般講演4「3次元 CT 方式+X線ステレオ方式 X線検査装置」

アイビット 向山 敬介

- 16：30～16：50 フリーディスカッション

- 16：50 閉会挨拶

- 17：00～18：00 技術交流会

注1) プログラムは変更になることがあります。ご了承ください。

- ◆ 定員： 100名 (先着申し込み順 定員になり次第締め切ります)

〈参加申し込みは当日まで受け付けますが、予稿集などの準備の関係上、事前登録にご協力をお願いします。〉

参加者の皆様にはご名刺を頂戴いたしますので、ご用意ください。ご名刺がない場合には、ご記帳いただきます。

- ◆ 参加費 (予稿集代込み、消費税込み)

正会員：5,000円

賛助会員：6,000円

シニア会員：1,000円

名誉会員：無料

非会員：10,000円

学生会員：無料 (学生証を受付で提示してください)

会員外学生：1,000円 (学生証を受付で提示してください)

注1) 参加費は当日会場受付にて、現金にてお支払い願います。つり銭の無いようご準備をお願いします。

注2) 賛助会員クーポン券のご利用はできません。

注3) 交流会参加は無料ですが、準備の都合上、出欠予定を所定欄にご記入ください。

◆ 申込方法

申し込みはこちら (https://web.jiep.or.jp/seminar/tcwg/tc11_ase20190723/)

上記 URL から登録されますと確認メールが送信されます。

キャンセル用の URL は、登録完了メールに記載されます。

◆ 問い合わせ先

エレクトロニクス実装学会 事務局 03-5310-2010 ase@jiep.or.jp